



ResMap 168

抵抗率測定装置

4 探針法・手動／自動・卓上型

ResMap 168 は 300 mm 以下サイズ用の最も一般的なモデルです。薄膜の技術者の信頼に応えられる信頼性、正確性、再現性を備えています。自動カセット搬送機能が搭載され、CMP、イオン注入、拡散プロセスの開発及びモニタリング等での薄膜測定における維持費低減を実現します。

Specifications

ウエハ搬送方法	カセットから自動移載	エッジ除外 (最小)	1.5mm (プローブ中心から基板端まで)
ウエハサイズ	4~8インチ (自動) 2~8インチ (手動)	コンピューターシステム	Computer CPU 3.2GHz I3, 4GB memory, 1TB hard drive, operating system: Windows XP
最大径	8.2インチ(208mm)	SECS-II オプション	可能
標準測定時間	1点あたり1秒	マッピングパターン	円形マッピング (ノッチ／フラットに合わせる或いはフラットに沿う)、長方形マッピング、ラインスキャン (直径、半径、または直径に沿った任意の2点間、最小間隔0.1 mm)、ユーザーにて定義可能 (テンプレート)
標準ウエハ搬送時間	10秒	プロット	等高線 (間隔選択、1/3σ、固定および自動)、3D、直線、データマップ、ヒストグラム、データシーケンス、半径方向および角度方向分布、各種モードのトレンドチャートが使用可能
標準ノッチ検出時間	オプションのノッチ検出で12秒	データ	ResMapのデータファイルはすべて分析用にエクセル等のプログラムへ書き込みが可能
最大スループット	40 wph (49点) 80 wph (5点)	Facilities	
測定範囲	1 mΩ/sq- 10MΩ/sq (1 mΩ/sqに最適化可能)	工場側真空	>500mmHG (チューブ径: 1/4インチ)
再現性	静止状態: ≤±0.02% 可動状態: ≤±0.1% (near by spots, typical)	電源	100V ~ 240V < 10 KVA
精度	≤±0.5% NIST規格による	寸法(幅×奥行×高)	12"× 28"× 10" (304mm×711mm×254mm)

NTE
NAGASE Group

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

Creative Design Engineering, Inc.
20565 Alves Drive, Cupertino, CA 95014 USA
Tel: +1-408-736-7273 Fax: +1-408-738-3912
www.CDE-ResMap.com

Rev. 080422